

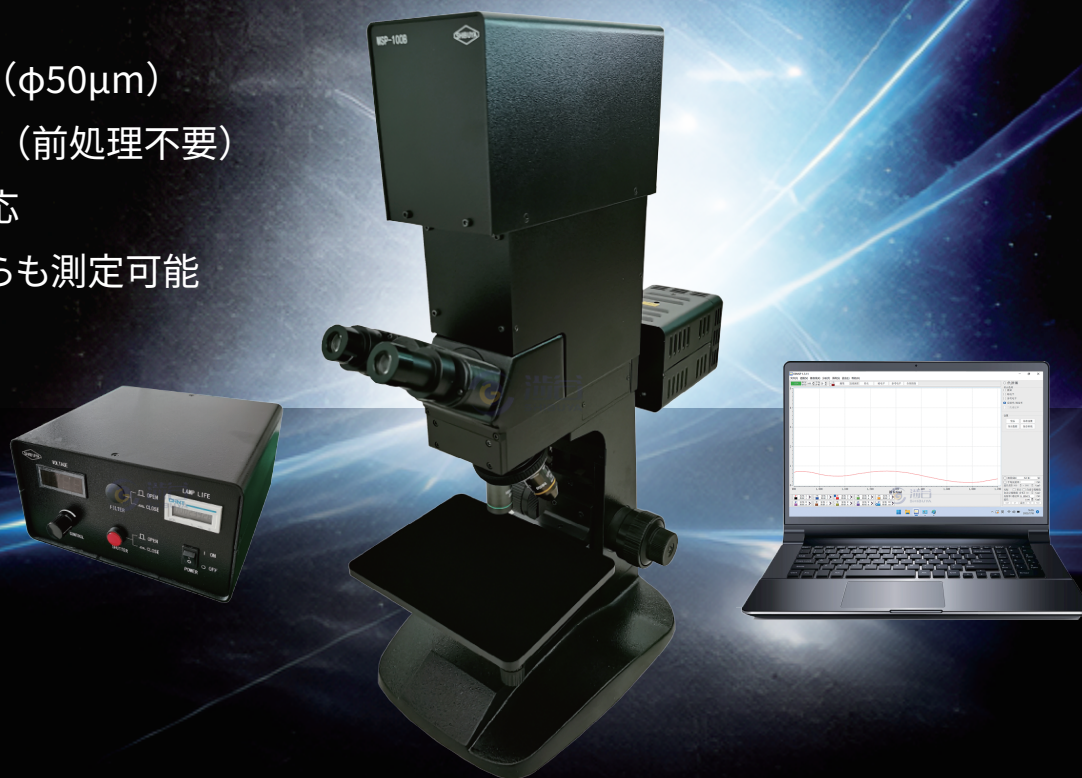
反射率測定装置



MSP-100B/IR/UV

微小領域 × 高感度 × 簡単測定

- ✓ 微小スポット測定 ($\phi 50\mu\text{m}$)
- ✓ 背面光の影響なし (前処理不要)
- ✓ 可視～UV～IR 対応
- ✓ レンズ・平面どちらも測定可能



高感度 CCD・InGaAs センサーで高 S/N 測定を実現

測定波長

B : 350-1100nm
IR : 900-1700nm
UV : 230-800nm

性能

再現性 : $\pm 0.02\%$
分解能 : 1nm
測定時間 : 数秒

装置仕様

電源 : 100-240V
寸法 : W230×H605
×D510mm
重量 : 15kg

高性能とコストバランスを両立した
反射率測定ソリューション



詳細仕様はこちら

株式会社 渋谷光学

〒351-0111 埼玉県和光市下新倉3-22-2

☎ 048-469-1200 📠 048-469-1311

渋谷光学で検索

